



SEMI Standards Publication Certificate

SEMI 标准发布证书

NO.:2018-08

Standard No.: SEMI HB9-0818
标准编号: SEMI HB9-0818

Standard Name: Test Method and Acceptance Criteria for Visual Inspection of Surface Defects of GaN Epitaxial Wafers Used for Manufacturing HB-LED

标准名称: HB-LED外延晶片表面缺陷检测方法及标准

Publication Date: August, 2018

发布日期: 2018年8月

标准编制工作组

SEMI HB-LED

主编单位: 华灿光电(浙江)有限公司

参编单位: 江西兆驰半导体有限公司、佛山国星光电股份有限公司、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、南京益芯合半导体科技有限公司、中微半导体设备(上海)有限公司、哈尔滨工业大学

起草人: 吴志浩、王江波、武良文、闫春辉、刘建哲、刘逸枫、郑松森、刘英斌、甘阳

